



Analytical Solution Plaza

「はかる」のプロフェッショナルが  
ニーズに応じたソリューションを提供します。



## 受託分析サービスのご案内



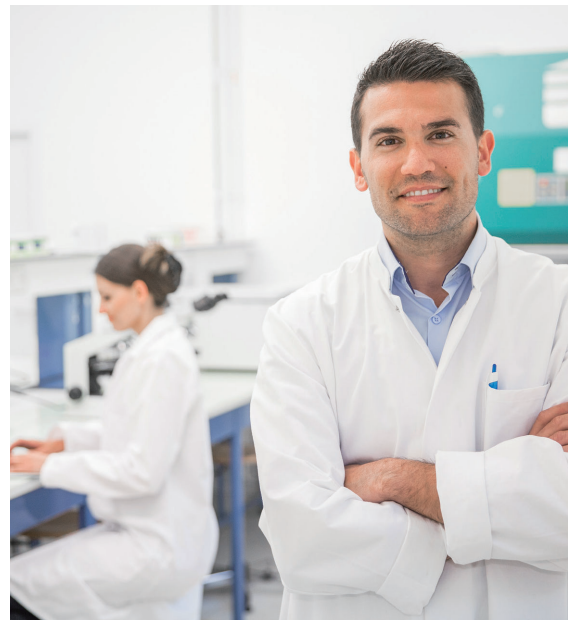
**HORIBA**



## Analytical Solution Plaza

### 「はかる」と「わかる」をつなぐHORIBAのサービス

堀場テクノサービスは、HORIBAが長く蓄積してきた分析・計測ノウハウを活用し、製品が最高のパフォーマンスを発揮するためのフィールドサービス（修理・保守・点検）はもちろん、分析アプリケーションラボ「Analytical Solution Plaza」での分析受託、立会い分析、機器開放、トレーニング、校正や、先端機器のテストなど、お客様の課題を解決するための高付加価値なサービスをご提供します。サービスメンテナンスを専門とする堀場テクノサービスならではのこまやかな対応と、Analytical Solution Plazaの豊富な実績による確かな技術力で、お客様の分析・計測を幅広くサポートします。



#### 受託分析

事前の打合わせを元にお客様の試料をお預かりして測定、分析、解析を行います。受託分析に関する短期・長期契約、プロジェクトサポート契約については、別途お問い合わせください。

#### 立会い分析

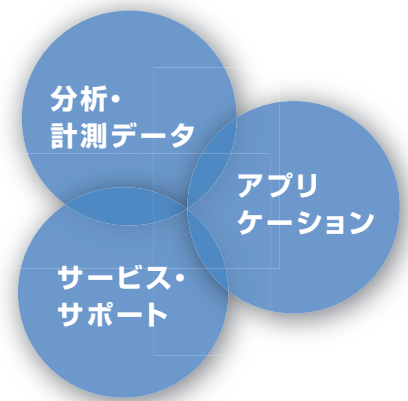
受託分析に際して、お客様にAnalytical Solution Plaza（京都・東京）に来社いただき、測定、分析に立会いいただけます。またインターネットのリモート機能を利用することにより、遠隔から測定に立会いいただくことも可能です。リアルタイムに分析条件や結果をご確認いただけます。

#### 機器開放 AOP Shared Lab

お客様にAnalytical Solution Plaza（京都・東京）に来社いただき、装置を半日（3時間）または、1日（10:00～17:00の6時間）ご使用いただくサービスです。分析技術者がお客様の希望に沿って一緒に測定、分析を行います。もちろんご希望があればお客様自身で測定していただくことも可能です。時間内であれば試料数に制限はありません。機器開放の対象となっている製品については、別途お問い合わせください。

#### トレーニング・ユーザセミナー

お客様がご使用になりたい分析装置について、試料に応じた最適な測定条件、分析ノウハウおよび解析手法などを分析技術者がわかりやすくご説明いたします。1日コース（6時間）、半日コース（3時間）、お客様サイト、Analytical Solution Plazaのいずれかご要望に応じて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。ユーザ様向けのセミナーも実施しています。



**ONE STOP SERVICEで、  
世界中の分析・計測ニーズに  
対応します。**



# 分析試験項目一覧

各種サービスに対応した分析試験項目例をご紹介します。



粒子径分布・物性測定・画像観察	装置・分析法略称	分析試験項目	京都	東京
粒子径分布測定				
レーザー回折/散乱式フロー	Partica	粒子径分布測定(湿式/乾式) 各種オプション(高濃度試料)	●	●
粒子ナノトラッキング法	ViewSizer	粒子径分布測定		●
動的光散乱式	nanoPartica	粒子径分布測定	●	●
		ゼータ電位測定	●	●
分光エリブノメトリー	UVISEL/AutoSE	膜厚測定、光学定数、物質特性評価 マッピング	●	●
プローブ顕微鏡画像	AFM-Raman	トポ像、分光(ラマン/PL)像	●	●
X線透過画像	大型CT	X線透過画像	●	●
光学顕微鏡写真		明視野・暗視野・偏光観察・微分干渉	●	●
電子顕微鏡写真		反射電子像・二次電子像	●	●
元素分析	装置・分析法略称	分析試験項目	京都	東京
エネルギー分散型X線分析	SEM/EDS	スペクトル測定	●	●
		イメージング 5元素～	●	●
蛍光X線分析	EDXRF	ポイント分析(1 mmφ～)	●	●
微小部蛍光X線分析	μ-EDXRF	ポイント分析(10 μmφ～)	●	●
		イメージング 5元素～	●	●
固体中炭素・硫黄・酸素・窒素・水素分析				
炭素(C)・硫黄(S) 酸素中燃焼赤外線吸収法	EMIA	定量	●	
		昇温分析	●	
酸素(O) 不活性ガス融解—赤外線吸収法	EMGA	定量	●	
		昇温分析	●	
窒素(N)・水素(H) 不活性ガス融解—熱伝導度法	EMGA	定量	●	
		昇温分析	●	
高周波グロー放電発光分析	GD-OES	深さ方向元素分析(Depth profile)	●	●
		成分分析 (ICPのスクリーニング, SPARK, EDS, XRFの代替)	●	●
		前処理エッチング(イオンミリング)	●	●
		各種オプション測定	●	●
高周波誘導結合プラズマ発光分析	ICP-OES	定量	●	
組成分析・構造解析	装置・分析法略称	分析試験項目	京都	東京
顕微ラマン分光分析	LabRAM-HR/XploRA	イメージング	●	●
		データ解析(多変量解析他)	●	●
蛍光リン光分光分析	Fluorolog/FluoroMax	励起・発光スペクトル 異方性・時間分解発光スペクトル等 (UV~VIS~NIR)	●	
	Duetta/Aqualog	3次元発光スペクトル(蛍光EEM)	●	●
時間分解発光分析(時間相関単一光子計数)	DeltaFlex	発光寿命測定(蛍光・リン光)	●	
カソードルミネッセンス	CL	結晶欠陥評価		●
イメージングカソードルミネッセンス	iCL	結晶欠陥評価		●
赤外分光分析				
フーリエ変換赤外分光 顕微フーリエ変換赤外分光	FT-IR	スペクトル測定	●	●
		マッピング/ポイント分析		●
質量分析	GC-MS	有機成分分析	●	
溶液測定	装置・分析法略称	分析試験項目	京都	東京
イオンクロマトグラフ	IC	定量(13元素/パック)	●	
油分濃度	OCMA	定量(抽出込み)	●	
全リン全窒素(環境省維持管理試験)	TPNA	定量	●	
化学的酸素要求量(COD)	CODA	定量	●	
旋光度測定(レーザー仕様)	SEPA	定量	●	●



# 受託分析サービスの流れ

受託分析サービスのお申込みの流れについてご説明します。  
ご不明点はお気軽にお問い合わせください。



## お問い合わせ

Webのお問合せフォームまたは  
電話にてご連絡ください。

## 測定内容 打ち合わせ

専門スタッフもしくは、技術担当者が  
ご依頼の内容についてお話を伺います。

## お見積

お客様のご依頼に合わせて分析のプランを  
ご提案・お見積を作成します。

## ご注文

お見積の内容をご確認いただき  
ご承諾いただける場合はご連絡ください。

## 測定実施

試料をご送付いただくか、お客様立会いの  
もとで分析を実施させていただきます。

## 分析結果の報告

分析結果の報告書を提出します。  
内容についての質問にお答えします。

## お支払い

報告書とあわせて納品書と請求書  
を送ります。

※ご希望に応じて、ご契約時に秘密保持契約を締結します。

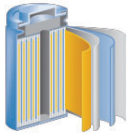
### よくあるご要望やお問い合わせ

- 分析機器の導入を検討しているが、予算確保までの期間、機器を使って測定を始めたい。
- 短期間のプロジェクトなので資産管理上、装置は所有したくない。
- 定期的に測定したいが、サンプルが少数なので必要な分だけ外注サービスを利用してコストダウンしたい。
- 大学や公設試験研究機関に共同機器利用はあるが、サンプルを測定するために必要な精度や感度が足りない。
- マニュアルを読んだだけではうまく測定ができない。社内で使い方を聞ける人がいない。適切な測定条件出しを手伝ってほしい。
- 卒業論文の作成時期になると大学の共用装置が混み合い、すぐに測定できない。論文作成用に測定したい。

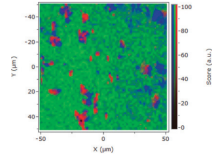
# 最先端材料から環境分析まで、分析ニーズに応える装置をご用意しています。

## ■ 分析例

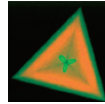
### 材料評価



- 電池の分析
  - ・劣化状態評価
  - ・電極材料の粒子径評価
  - ・内部異物の解析
  - ・マンガン酸リチウムの酸素欠損量
- 触媒性能評価
- 太陽電池
- 有機EL
- パワーデバイス
- 2Dナノ材料(グラフェン、MoS<sub>2</sub>)



化学成分ラマンイメージング  
赤:導電助剤 青:活物質 緑:バインダー



AFMラマン/PLイメージ(2D WS<sub>2</sub>)



- 炭素・硫黄分析装置
- 酸素・窒素・水素分析装置



- レーザ回折 / 散乱式  
粒子径分布測定装置

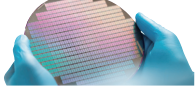


- AFM(原子間力顕微鏡)ラマン



- 微小部蛍光X線分析装置

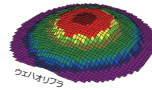
### 半導体関連



- 多層膜解析(膜厚・屈折率・消衰係数を評価)
- 化合物半導体のバンドギャップ、不純物評価
- SiCやGaNウエハ表面の結晶性、欠陥評価
- 薄膜中深さ方向元素分析
- 化合物半導体バンドギャップ
- 膜中深さ方向元素分析
- SiCやGaN表面の結晶性および欠陥評価
- 半導体パッケージ解析

表面層
AlGaIn (568.6nm)
AlN (669.6nm)
サファイア基板

LED構造



紫外線LED AlGaIn膜厚分布



- 分光エリプソメータ

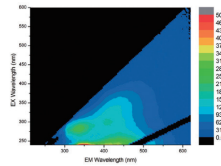


- フォトルミネッセンス  
測定装置 (PL)

### 環境分析



- マイクロプラスチックの分析
- 洗浄部品の
  - ・残留油分定量
  - ・洗浄水中イオンによる清浄度評価
- 排水中成分分析
  - ・全リン・全窒素、COD、成分分析
  - ・成分元素(蛍光X線法)
- 環境水 / 排液
  - ・溶存有機物(フミン酸、フルボ酸)
  - ・油分濃度



河川水CDOMの蛍光EEM



- マーカス型高周波グロー放電  
発光表面分析装置



- カソードルミネッセンス  
イメージング装置 (CL)



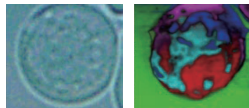
- 顕微レーザーラマン分光測定装置



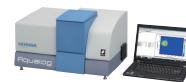
- ナノ粒子径分布・  
濃度測定装置

### その他

- 細胞ラマンイメージング
- 医薬品錠剤の薬剤分布、成分定量
- 抗体医薬品の凝集評価
- 特定のエクソソームの個数濃度測定
- 文化財美術品分析
- 分子間相互作用評価



浮遊細胞ミエロームのラマンイメージ



- 三次元蛍光測定装置  
蛍光EEM



- 油分濃度計

## 分析サンプルの具体例

- パワーデバイス(半導体)
- 電池(LIB・全固体電池)
- 触媒、炭素材料(CNT・グラフェン・フラーレン)
- セラミックス・ガラス(ディスプレイ・植物ファイバー)
- 食品(飲料品、お酒)
- 医薬品(錠剤・粉末)
- 化粧品(粉末・乳液・クリーム)
- エクソソーム
- ペプチド
- 鉱物
- 紙
- インク
- 残留油分
- 木材
- 絵画
- 金属
- 蛍光体
- QD(量子ドット)
- 高分子材料(ゴム、ゲル、フィルム、プラスチック)等

ご相談をお受けします

お問い合わせ

堀場テクノサービス コンタクトセンター

**0570-200-809**

受付時間 / 9:00~12:00, 13:00~17:00 (祝祭日を除く月曜日~金曜日)  
<https://www.horiba.com/jp/scientific/application-center-jp/contract-analysis/>

受託分析サービスの詳細は、QRコードまたは、「HORIBA分析」の検索からアクセスいただけます。

HORIBA分析

検索



アクセスマップ



地下鉄駅

東京

〒101-0063  
 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番  
 (神田淡路町二丁目ビル)  
 TEL 03-6206-4750(代)

東京メトロ 丸の内線  
 「淡路町」駅A3,A5出口より徒歩3分

都営地下鉄 新宿線  
 「小川町」駅A3,A5出口より徒歩3分

東京メトロ 千代田線  
 「新御茶ノ水」駅B2出口より徒歩5分

東京メトロ 銀座線  
 「神田」駅6番出口より徒歩6分

JR中央線 総武線  
 「御茶ノ水」駅聖橋口より徒歩6分

JR山手線/中央線/東京メトロ  
 「秋葉原」駅電気街口より徒歩7分

京都

〒601-8510  
 京都市南区吉祥院宮の東町2  
 TEL 075-313-8125(代)

・JR京都線「西大路」駅より徒歩13分

・阪急京都線「西京極」駅より徒歩15分



コンビニエンスストア

カタログNo. HTS-Lab-0048A

Printed in Japan 2205SK32